

1. Record Nr.	UNICAMPANIAVAN0126542
Titolo	Electrical Atomic Force Microscopy for Nanoelectronics / Umberto Celano editor
Pubbl/distr/stampa	Cham, : Springer, 2019
Descrizione fisica	XX, 408 p. : ill. ; 24 cm
Disciplina	621.36 543.5 530 502.82 620.5 621.381
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia

2. Record Nr.	UNICAMPANIAVAN00250024
Autore	Nolan, John P.
Titolo	Univariate Stable Distributions : Models for Heavy Tailed Data / John P. Nolan
Pubbl/distr/stampa	Cham, : Springer, 2020
Titolo uniforme	Univariate Stable Distributions
Descrizione fisica	xv, 333 p. : ill. ; 24 cm
Soggetti	60E07 - Infinitely divisible distributions; stable distributions [MSC 2020] 60F05 - Central limit and other weak theorems [MSC 2020] 62F12 - Asymptotic properties of parametric estimators [MSC 2020] 62F30 - Parametric inference under constraints [MSC 2020] 62F35 - Robustness and adaptive procedures (parametric inference) [MSC 2020]
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia